| HƯỚNG DẪN KIỆM TR | A DỮ LIỆU QUA | ANG HỌC VÀ CHỈ | NH ĐIỀU KIỆN EXPOSING |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Số: 000-4-WI-0182 | Phiên bản: 13 | Trang: 1/35 | 000-4-WI-0182/13 |

I. Muc đích

Tài liệu này nhằm hướng dẫn cách monitor và điều chỉnh điều kiện Exposing dựa trên phân tích kết quả test loss và đo optical hàng ngày và hướng dẫn cài đặt chương trình Exposing.

II. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho Leader/Operator hỗ trợ kỹ thuật/Kỹ sư trở lên chuyền Cavity FG.

III. Định nghĩa thuật ngữ

HDCV: Hướng Dẫn Công Việc.

Center Wavelength (CW): Bước sóng giữa

Reflectivity: Hệ số phản xạ

Full Width Half Max (FWHM): Độ rộng ở giữa bụng sóng

Side Lobe Suppression Ratio (SLSR): tỉ lệ ngắn nhất độ cao giữa bước sóng trung tâm và bước sóng 2 bên

Exposing: Công đoạn tạo ra tính chất sản phẩm Optical measurement: Công đoạn đo quang học.

LSL: Cận dưới của chuẩn USL: Cận trên của chuẩn Leader: Tổ trưởng sản xuất Operator: Công nhân

Spectrum Uniform: Quang phổ dạng uniform Spectrum Chirp: Quang phổ dạng chirp

Apodization: Sư thay đổi của ánh sáng đến vùng exposing (grating) nhằm giảm dần các bước nhiễu xa

IV. Quy định chung

- Phải đeo kính bảo hộ đặc biệt chống tia laser khi chỉnh thẳng hàng máy Excimer laser hoặc PTE khi vệ sinh, bảo trì, sửa chữa máy laser.
- Chỉ những người đã được đào tạo mới được chỉnh máy laser hoặc chỉnh điều kiện Exposing
- Ưu tiên sử dung fiber cuối reel để test máy.
- Thay phase mask định kỳ hàng tháng nếu sản phẩm chạy liên tục hoặc kiểm tra và thay theo yêu cầu của kỹ sư.
- Khi tìm điều kiện của sản phẩm mới hoặc line mới phải sử dụng template 4-Pr-007-4-Fo-0006-4-TEM-0001 để kiểm tra các thông số trước khi chạy sản phẩm hàng loạt.
- Khi tiến hành bảo trì máy cần chú ý tắt máy, khóa các van khí, ngắt nguồn điện trước khi thực hiện.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 2/35

V. Nội dung: 1. Ouy trình kiểm tra

| Bước | y trình kiêm tra Leader/Operator hỗ trợ kỹ thuật trở lên | Leader Technician/Kỹ sư trở lên | Mô tả | Tham khảo |
|------|--|---|--|------------------------|
| 1 | Thu thập dữ liệu | | Leader trở lên có nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu Exposing và dữ liệu test loss ít nhất 2 lần/ca. | |
| 2 | Kiểm tra dữ liệu bằng chương trình. | Không tốt | - Leader/Technician/Operator hỗ trợ kỹ thuật/Kỹ sư kiểm tra bằng chương trình monitor tại máy tính sử dụng chung đặt tại chuyền. - Kỹ sư có thể kiểm tra tại máy tại chuyền hoặc lưu dữ liệu về máy tính cá nhân để kiểm tra. | Mục 2.1 |
| 3 | Theo dõi | | Nếu dữ liệu không có gì bất thường thì tiếp tục theo dõi | SPC monitoring |
| 4 | Đa | ân tích dữ liệu/ ánh giá kết quả nguyên nhân và | Nếu Leader/Technician/Operator hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra mà kết quả không tốt, bất thường thì báo Leader Technician/Kỹ sư trở lên. Leader Technician/Kỹ sư trở lên tiến hành phân tích dữ liệu, điều tra nguyên nhân. | Mục 2.2 |
| 5 | đưa : | ra/thực hiện biện khắc phục | Dựa trên phân tích dữ liệu, tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp để khắc phục. Biện pháp khắc phục báo Kỹ sư trở lên. | Bảng 1 và Mục 3 |
| 6 | lid | Theo đôi dữ ệu/kết quả sau thi khắc phục Không tốt | Sau khi đưa ra biện pháp khắc phục, điều chỉnh điều kiện Exposing thì phải theo dõi kết quả. Nếu kết quả sau khi điều chỉnh vẫn chưa hiệu quả thì tiếp tục phân tích/điều chỉnh và theo dõi. | |
| 7 | | g tin tới người chịu n nhiệm liên quan | - Chia sẻ đến những thành viên liên quan (Leader/Technician/Operator hỗ trợ kỹ thuật trở lên) | Report/Email/ Phone |
| 8 | Kết | t thúc quá trình kiểm tra | Kỹ sư kiểm tra báo cáo và xác nhận kết quả. Lặp lại ở trên(bước 1)===> tiếp tục theo dõi và kiểm soát | |

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

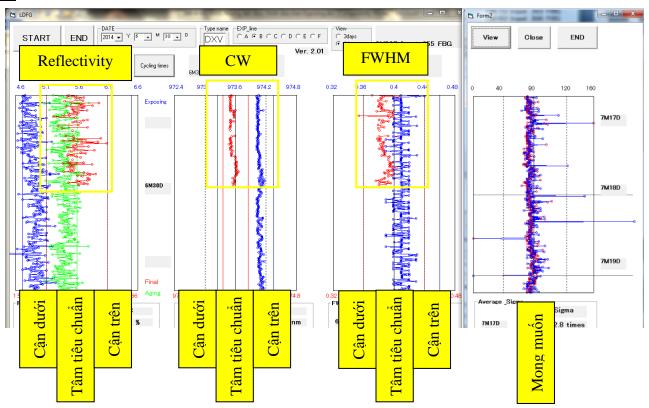
Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 3/35

2. Kiểm tra và phân tích dữ liệu test loss

2.1 Kiểm tra bằng chương trình Monitor

- Leader/Technician/Operator hỗ trợ kỹ thuật/Kỹ sư có nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu test loss ít nhất 2 lần/ca để phát hiện những bất thường và kịp thời kiểm tra, thay đổi điều kiện Exposing.
- Nếu phát hiện bất thường thì tìm nguyên nhân để có phương án khắc phục kịp thời nhằm hạn chế tối đa sản phẩm lỗi. Theo hướng dẫn của "Bảng 1: xử lý sự cố chung".
- Bình thường, giá trị đo phải ổn định và dao động 2 bên đường tâm của tiêu chuẩn.
- Tiêu chuẩn các thông số đo theo "Bảng 2: tiêu chuẩn các thông số đo quang học"
- Chu kỳ Exposing ổn định.

Ví dụ 1: Giá trị đo tốt



Trong đó:

- LSL: Cận dưới của tiêu chuẩn ⇒ giá trị nhỏ nhất
- Tâm tiêu chuẩn: Giữa tiêu chuẩn ⇒ giá trị mong muốn
- USL: Cận trên của tiêu chuẩn ⇒ giá trị lớn nhất
- Chấm màu xanh lá là giá trị sau Exposing, màu đỏ là đo Loss (màu xanh dương là trước gia nhiệt)

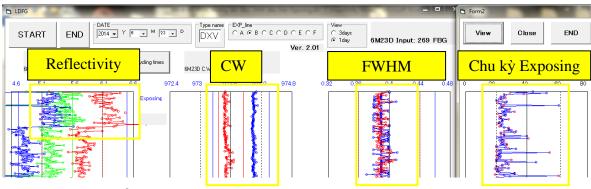
* Reflectivity và CW: Tốt

- Giá trị đo nằm dao động 2 bên đường tâm của tiêu chuẩn
- Độ dao động nhỏ
- * FWHM: Tốt
- Giá trị tập trung bên dưới đường tâm tiêu chuẩn nhưng ổn định
- * Chu kỳ Exposing: Tốt
- Độ dao động thấp và giá trị ổn định.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 4/35

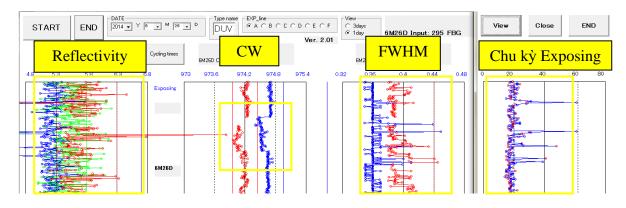
Ví dụ 2: Reflectivity bất thường



* Reflectivity: Bất thường

- Giá trị đo nằm dao động 2 bên đường cận trên của tiêu chuẩn
- Độ lệch giữa giá trị Exposing và giá trị đo loss lớn.
- ⇒ Khắc phục: phân tích dữ liệu Exposing và dữ liệu đo Loss, điều chỉnh target Reflectivity
- * CW: Tốt
- Giá trị đo quang học nằm gần đường tâm của tiêu chuẩn
- * FWHM: Tốt
- Giá trị tập trung bên dưới và gần đường tâm tiêu chuẩn nhưng ổn định
- * Chu kỳ Exposing: không ổn định
- Độ dao động lớn
- Giá tri trung bình khá cao.
- ➡ Khắc phục: kiểm tra vị trí fiber, độ lệch tia laser sau đó điều chỉnh thấu kính để tăng/giảm năng lượng. Nếu vẫn chưa ổn định thì vệ sinh rãnh má kẹp, kiểm tra thao tác đặt fiber của Operator.

Ví dụ 3: CW bất thường



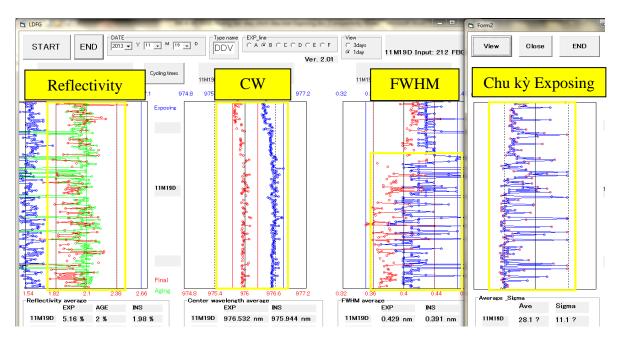
* Reflectivity: Tốt

- Giá trị giao động khá lớn nhưng nằm trong tiêu chuẩn
- * CW: Bất thường
- Giá trị Exposing và giá trị đo Loss giảm đột ngột và gần vượt ra đường cận dưới của tiêu chuẩn
- ⇒ Khắc phục: Tắt chương trình, khởi động lại máy tính và kiểm tra sự thay đổi lot fiber. Nếu có đổi lot fiber thì tiến hành điều chỉnh giá trị mask position.
- * FWHM : Tốt
- Giá trị dao động 2 bên đường tâm tiêu chuẩn
- * Chu kỳ Exposing: Tốt
- Chu kỳ ổn định và độ dao động thấp.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIÊU OUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIÊN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 5/35

Ví dụ 4: FWHM và chu kỳ bất thường



- * Reflectivity: Tốt
- Giá trị trung bình thấp hơn đường tâm nhưng vẫn nằm trong tiêu chuẩn
- * CW: Tốt
- Giá trị có bất thường ở khoảng đầu nhưng sau đó ổn định và dao động xung quanh đường tâm tiêu chuẩn
- * FWHM: bất thường
- Giá trị dao động lớn, không ổn định
- ⇒ Khắc phục: kiểm tra thao tác đặt fiber vào rãnh của Operator (fiber đặt quá chùng hoặc quá căng)
- * Chu kỳ Exposing: không ổn
- Giá trị dao động lớn, không ổn định
- ➡ Khắc phục: kiểm tra vị trí fiber, độ lệch tia laser sau đó điều chỉnh thấu kính để tăng/giảm năng lượng. Nếu vẫn chưa ổn định thì vệ sinh rãnh má kẹp, kiểm tra thao tác đặt fiber của Operator.

2.2 Phân tích dữ liệu và thay đổi điều kiện Exposing.

- Khi phát hiện dữ liệu có sự bất thường thì Leader/Technician/Operator hỗ trợ kỹ thuật/Kỹ sư phải tiến hành phân tích dữ liệu Exposing và dữ liệu đo Loss để tìm nguyên nhân, xu hướng để đưa ra phương án khắc phục.
- Thông thường phân tích dữ liệu để tìm độ lệch 2 port, độ lệch giữa Exposing và Loss. Các sự cố khác theo hướng dẫn của "bảng xử lý sự cố chung".
- Tiêu chuẩn đánh giá dựa vào "Bảng 3: tiêu chuẩn các thông số đo quang học"
- Độ lệch Reflectivity giữa 2 port phải nhỏ hơn hoặc bằng 0.1%.

Ví dụ: Reflectivity thấp

- Tính giá trị trung bình của mỗi cổng cho từng công đoạn

| Công đoạn | Tổng | Р3 | P4 | Tiêu chuẩn | Đánh giá |
|---------------------------------------|------|------|------|------------|----------|
| Giá trị trung bình công đoạn Exposing | 1.89 | 1.88 | 1.89 | | |
| Giá trị trung bình công đoạn Loss | 1.91 | 1.92 | 1.90 | 2.05~2.15 | Thấp |
| Độ lệch 2 port | | 0.01 | | ≤ 0.1 | Tốt |

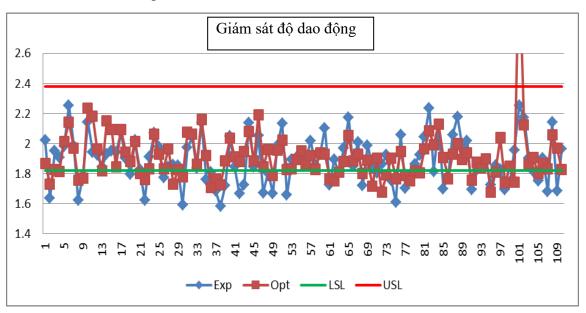
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 6/35

- Chú ý: Phải loại bỏ các giá trị bất thường khi tính giá trị trung bình.
 - Tùy nhóm hàng và độ dao động của REF của các nhóm khác nhau thì giá trị trong khoảng cũng khác nhau

Ví du : Tâm của tiêu chuẩn là 4% thì lấy giá trị nằm trong khoảng 4%+/- 0.5.

- Vẽ biểu đồ để xem sự phân bố dữ liệu



- Kết luận dựa trên phân tích dữ liệu:
- + Độ lệch 2 port tốt (< 0.1%)
- + Giá trị trung bình thấp.
- Phương án khắc phục
- + Điều chỉnh target tăng
- + Cách tính target như sau:

Target mới = (Target hiện tại x tâm tiêu chuẩn)/giá trị trung bình hiện tại

- + Tuy nhiên target mới phải dựa trên target tính toán và giá trị độ lệch giữa Exposing và đo Loss.
- + Thông thường chọn target mới nhỏ hơn target tính toán và theo dõi dữ liệu Exposing.

Chọn target mới = (target tính toán + target hiện tại)/2

- + Sau khi điều chỉnh target mới thì theo dõi dữ liệu Exposing của 10 con đầu tiên và điều chỉnh target tăng/giảm nếu cần.
- + Nếu giá trị đo Exposing chưa đạt thì tiếp tục tăng cho đến khi đạt giá trị trung bình mong muốn. (Giá trị target cài đặt không được cao hơn giá trị target tính toán)

2.3 Kiểm tra và phân tích dữ liệu test loss

2.3.1. Mục đích:

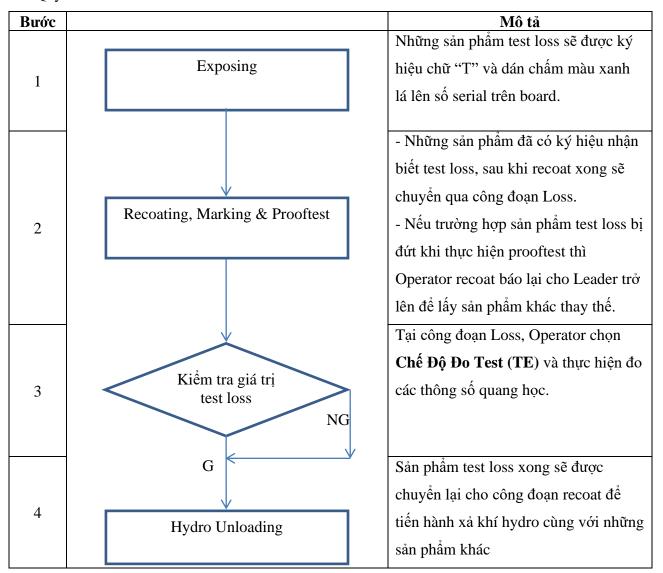
Tài liệu này nhằm hướng dẫn kiểm tra giá trị test loss sau khi thay đổi điện cực, máy hàn, loại sản phẩm, sau khi bảo trì/điều chỉnh điều kiện Exposing hoặc theo yêu cầu của kỹ sư.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 7/35

2.3.2. Quy trình kiểm tra test loss

- + Mỗi line Exposing tiến hành test loss tại thời điểm đầu mỗi ca làm việc hoặc theo yêu cầu.
- + Quy trình test loss

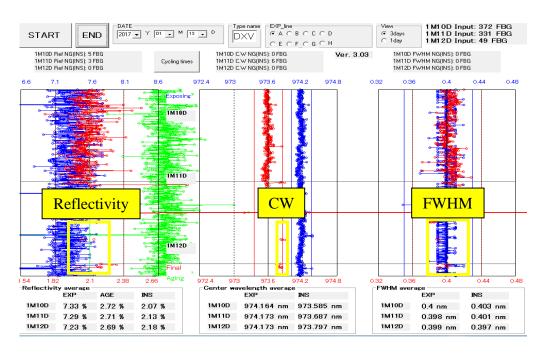


2.3.3. Tiêu chuẩn để kiểm tra giá trị test loss:

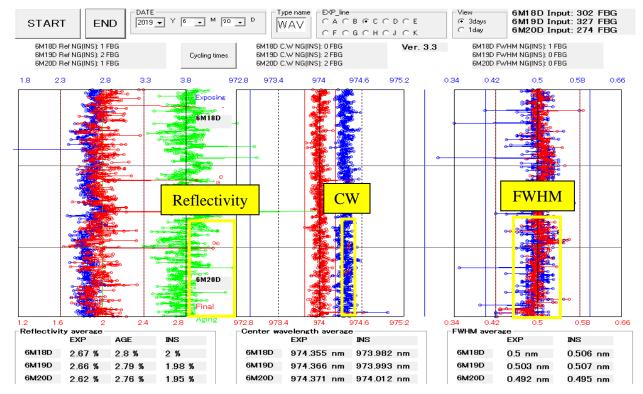
- Leader/Technician/Kỹ sư có nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu test loss để phát hiện những bất thường và kịp thời điều chỉnh điều kiện Exposing.
- Tiêu chuẩn đánh giá dưa vào từng loại hàng khác nhau.
 - 1) Đối với các loại hàng có Aging sau khi exposing như: DXV, DUV, DDV, DEV, YXV, YUV, YEV, YDV, YAV, HCV, HDV, HEV, NAV, NBV, NCV, NXV, NYV, NUV, NWV, SAV,SBV,SCV,...

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 8/35



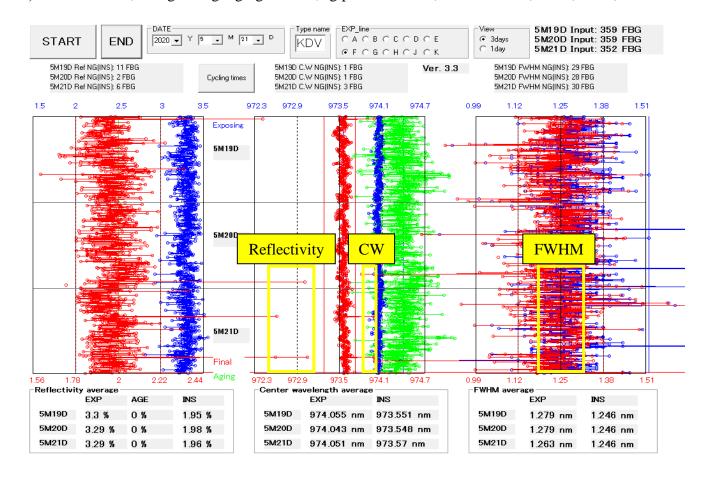
- * Reflectivity: Giá trị test loss của Reflectivity nằm trong tiêu chuẩn của sản phẩm (vùng ô màu vàng): Tốt
- * CW: Giá trị test loss của CW nằm trong/lân cận của cận trên của tiêu chuẩn (vùng ô màu vàng): Tốt
- * FWHM: Giá trị test loss của FWHM nằm trong vùng tiêu chuẩn của sản phẩm (ô màu vàng: Tốt
- 2) Đối với các loại hàng không Aging như WAV, WBV, JAV, JBV, CAV...



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 9/35

- * Reflectivity: Giá trị test loss nằm trong ô màu vàng: Tốt
- * CW: Giá trị test loss nằm trong ô màu vàng: Tốt
- * FWHM: Giá trị test loss nằm trong ô màu vàng: Tốt
- 3) Đối với các loại hàng không Aging và sử dụng phase mask loại C như: KBV, KDV, KCV, KEV



- * Reflectivity: Giá trị test loss nằm trong ô màu vàng: Tốt
- * CW: Giá trị test loss nằm trong ô màu vàng: Tốt
- * FWHM : Giá trị test loss nằm trong ô màu vàng: Tốt

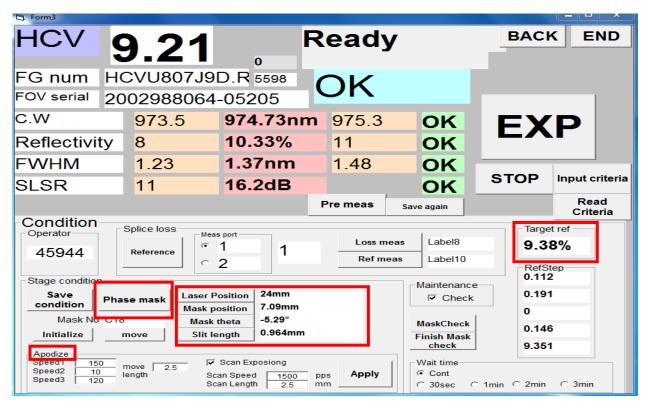
⇒ Lưu ý:

- Nếu giá trị test loss nằm ngoài ô màu vàng thì tiến hành test loss sản phẩm khác và kiểm tra lại
- Nếu giá trị kiểm tra quang dao động quá nhiều và khó kiểm soát thì sử dụng template ở đường dẫn sau để tính toán độ lệch \\fov\fileserver\PRD3\15-FG Cavity line\19. Template hỗ trợ kiểm tra giá trị test của exposing\CheckTestLoss

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 10/35

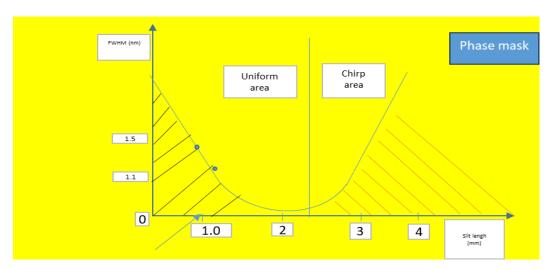
3. Các thông số Exposing



Hình 3.1

- Target Reflectivity: điều chỉnh giá trị Reflectivity
 - ➤ Tăng Target ⇒ giá trị Reflectivity tăng
 - ➤ Giảm Target ⇒ giá trị Reflectivity giảm
- Phase mask: là mặt nạ quang, góp phần tạo thành phần tạo ra đặc tính quang của sản phẩm (Bước sóng, FWHM..)

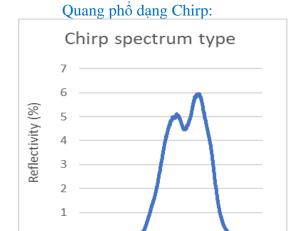
Tất cả phase mask đều có hai vùng quang phổ Uniform và chirp như hình ví dụ bên dưới



Hình 3.2

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 11/35



22 22 22 22 22 24 24 24 24 24

Wavelengh (nm)

Hình 3.3 Hình 3.4

- Spectrum type: mỗi loại hàng yêu cầu loại quang phổ khác nhau nên phải xác nhận loại quang phổ trước khi bắt đầu chỉnh(QC flow chart hoặc từ kỹ sư).
- Laser Position: điều chỉnh vị trí tia laser (chỉ có ở chương trình exposing ver8 trở lên)
 - ➤ Tăng Laser Position ⇒ tia laser dịch chuyển sang phải
 - ➤ Giảm Laser Position ⇒ tia laser dịch chuyển sang trái
- Mask position: điều chỉnh giá trị CW
 - Đối với quang phổ dạng Chirp :
 - + Tăng mask position ⇒ CW giảm
 - + Giảm mask position ⇒ CW tăng
 - Đối với quang phổ dạng Uniform:
 - + Tăng mask position ⇒ CW tăng
 - + Giảm mask position ⇒ CW giảm
- Mask theta: điều chỉnh góc nghiêng của phase mask
 - Mỗi line exposing sẽ có một giá trị mask theta khác nhau
- Slit length: điều chính giá trị FWHM

Đối với loại hàng có quang phổ dạng Chirped

- + Tăng Slit length ⇒ FWHM tăng
- + Giảm Slit length ⇒ FWHM giảm

Đối với loại hàng có quang phổ dạng Uniform

- + Tăng Slit length ⇒ FWHM giảm
- + Giảm Slit length

 ⇒ FWHM tăng
- Apodization: được sử dụng để tăng giá trị thông số của SLSR
 - + Bằng hoặc dưới -15dB: cần apodization
- + Trên -15dB: không cần apodization

Chu kỳ: ảnh hưởng tới tất cả các giá trị exposing

- Chu kỳ exposing được điều chỉnh dựa trên nguyên tắc:
 - + Tăng năng lượng laser ⇒ Chu kỳ giảm
 - + Giảm năng lượng laser ⇒ Chu kỳ tăng

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 12/35

- ➢ Vị trí thấu kính xa/gần phase mask để tăng/giảm năng lượng laser tùy thuộc vào mỗi loại tiêu cự của thấu kính (f1000, f700, f500).
- Ví dụ: đối với loại thấu kính có tiêu cự f1000, cách điều chỉnh chu kỳ như sau:
 - + Thấu kính gần phase mask ⇒ Năng lượng thấp ⇒ Tăng chu kỳ
 - + Thấu kính xa phase mask ⇒ Năng lượng cao ⇒ Giảm chu kỳ

Bảng 2: Xử lý sự cố chung.

| Thông số | Sự cố | Hiện tượng/Nguyên nhân | Kiểm tra/Khắc phục |
|--------------|---|--|---|
| | Giá trị Reflectivity lệch đường tâm | Giá trị Loss bị lệch một hướng (thấp hoặc cao) | Kiểm tra hệ thống Loss bằng master sample Kiểm tra target phù hợp với kết quả đo Loss. |
| | Giá trị Reflectivity dao động lớn | Giá trị Loss của 2 port bị lệch | Kiểm tra 2 port bằng master sample, độ lệch 2 port phải ≤ 0.1% |
| | | Chù kỳ Exposing không ổn định do năng lượng Laser yếu | Kiểm tra thấu kính và điều chỉnh vị trí để tăng năng lượng Kiểm tra vị trí fiber nằm trong khoảng 1/3 laser beam. Kiểm tra lệch tâm của tia laser từ máy Excimer Laser qua các gương, thấu kính. Kiểm tra cường độ laser và mật độ năng lượng ≤ 3mJ/mm² Kiểm tra năng lượng máy Excimer laser (chế độ HV 25.5Kv, 40Hz ≥ 120mJ). |
| Reflectivity | Giá trị Reflectivity không ổn định | Reflectivity step lớn (tiêu chuẩn <0.1dB) | - Kiểm tra giá trị Reflectivity step theo các bước sau: 1. Lấy data của line Exposing cần kiểm tra trong thư mục: R:\kensa\panda\expo_log 2. Đổi giá trị % sang dB (=10*log(X/100) => Vẽ biểu đồ phân bố. Tham khảo file Ref_Step_HEV.xlsx |
| | | | - Nếu Reflectivity step > 0.1dB thì tiến hành tăng cycle time để giảm năng lượng tia laser, từ đó sẽ giảm được Reflectivity step. |
| | Reflectivity và các thông số khác rớt thấp (Fiber lỏng) | Đặt fiber vào rãnh má kẹp Exposing bị chùng (không thẳng). Rãnh má kẹp bị dính bụi, tạp chất | Đặt thẳng fiber vào rãnh dụng cụ Vệ sinh rãnh má kẹp |
| | Suy hao mối hàn | Giá trị Reflectivity bị dao động cao | Kiểm tra số lần ARC điện cực ≤ giá trị quy định Kiểm tra fiber nguồn bị xoắn, bị uốn cong đường kính nhỏ. |
| CW | Giá trị CW cao/thấp | Giá trị mask position | Kiểm tra giá trị Exposing và Loss, điều |

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 13/35

| | | không phù hợp | chỉnh giá trị mask position |
|-------|---------------------------------|---|---|
| | Giá trị CW thay đổi đột ngột | Giá trị CW tăng hoặc giảm đột ngột và liên tục. | Tắt chương trình khởi động lạiKiểm tra thay đổi lot fiber |
| | Giá trị CW dao động | - Đặt fiber vào rãnh má kẹp Exposing bị chùng (không thẳng). - Rãnh má kẹp bị dính bụi, tạp chất | Đặt thẳng, căng fiber vào rãnh má kẹp Vệ sinh rãnh má kẹp Kiểm tra cài đặt "Control tension" + Đối với fiber 80um: giá trị cố định 10mg + Đối với fiber 125um: giá trị trong khoảng 15 – 40 mg |
| | FWHM cao/thấp | Giá trị slit length không phù hợp | +Kiểm tra giá trị Exposing và Loss, điều chỉnh giá trị slit length Chú ý: khi thay đổi slit length lớn(> 0.1nm) nên phải tắt chương trình, khởi động lại và test loss, theo dõi kỹ. |
| FWHM | Giá trị FWHM dao động | - Đặt fiber vào rãnh má kẹp Exposing bị chùng (không thẳng) Rãnh má kẹp bị dính bụi, tạp chất - Slit length bị mòn hoặc mẻ - Phase mask bị dơ | Đặt thẳng, căng fiber vào rãnh má kẹp. Vệ sinh rãnh má kẹp Làm theo hướng dẫn mục 5 Kiểm tra và tiến hành thay thế Phase mask mới. |
| | | Vị trí tia laser phản xạ lại chưa phù hợp | Kiểm tra spectrum trên OSA. Điều chỉnh lại vị trí tia laser phản xạ cho phù hợp |
| CI CD | CL CD 41.2 | Tia laser bị lệch | Kiểm tra lệch tâm của tia laser từ máy Excimer Laser qua các gương, thấu kính. Kiểm tra cường độ laser và mật độ năng lượng ≤ 3mJ/mm² |
| SLSR | SLSR thấp | Gương và thấu kính bị dính bụi, tạp chất. | Yêu cầu PTE thực hiện vệ sinh hệ thống gương, thấu kính định kỳ |
| | | Phase mask bị dính bụi, tạp chất | Kiểm tra và xịt bụi bằng súng khí Thay đổi vị trí hứng tia laser của phase mask Thay phase mask định kỳ Kiểm tra lại giá trị cài đặt Apodization |

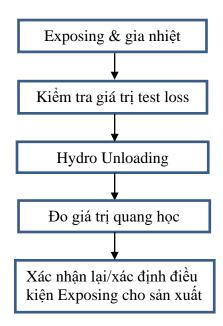
| HƯỚNG DẪN KIỂM TRA D | Ữ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOS | ING |
|----------------------|---|--------------|
| Số: 000-4-WI-0182 | Phiên bản: 13 | Trang: 14/35 |

Tham khảo cách chọn phase mask cho từng loại sản phẩm theo bảng 3.

Bảng 3. Phase mask cho từng loại sản phẩm

| Phase mask type | Central pitch | Chirp | Product type |
|--------------------|---------------|------------|--|
| С | 675 nm | 10.4 nm/cm | KYV, KXV, KAV, KBV, HAV, HBV, HCV, HDV, KWV, KDV, UAV, RCV, RDV |
| Н | 673 nm | 2.8 nm/cm | YDV,DDV,NBV,NDV, NXV,NUV,SCV |
| L | 670.3 nm | 1.0 nm/cm | XAV, XCV, XDV, WAV, HEV, DXV, JAV, JYV, DUV, DXV, DDV, NCV, NYV,NWV,YXV, CAV,SAV,SBV,TAV |
| LL | 670.5 nm | 0.1 nm/cm | XAV, WAV, DXV, JAV, JYV, DUV, DXV, DDV |
| Т | 669 nm | 2.8 nm/cm | DXV, DUV, JAV, JYV, WAV,NAV, NWV, NCV, NYV |
| Υ | 669 nm | 2.8 nm/cm | DXV, DUV, JAV, JYV, WAV |

- Ưu tiên sắp xếp chuyền Exposing sao cho tận dụng được tối đa số shot của máy Excimer laser (4 chuyền/máy laser)
- Đối với những nhóm hàng mới hoặc sản xuất lại sau một khoảng thời gian dài dừng sản xuất, Kỹ sư /Kỹ thuật viên cần phải xác nhận điều kiện Exposing trước khi chạy hàng theo quy trình sau:



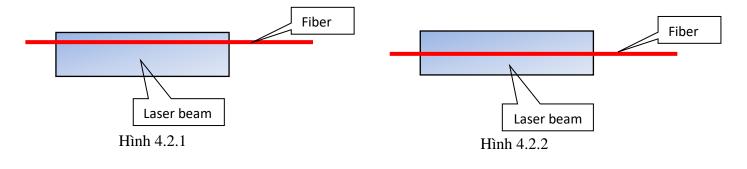
4. Hướng dẫn align

4.1 Các trường hợp nên align.

- + Chu kỳ chạy không ổn định hoặc lâu hơn/nhanh hơn bình thường
- + Giá trị Reflectivity tăng lên chậm.
- + Ánh sáng laser bị lệch bị lệch khỏi vị trí fiber
- + Giá trị SLSR cao.

4.2. Những trường họp align.

4.2.1 Kiểm tra vị trí fiber trần nằm trong ánh sáng như hình 4.2.1, 4.2.2

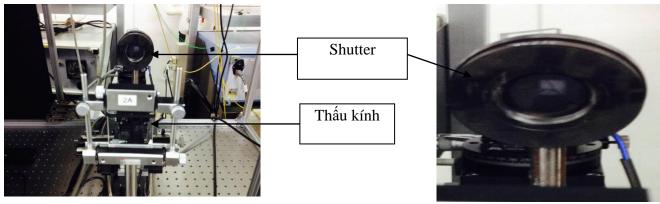


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 15/35

4.2.2 Ánh sáng phản xạ lại từ thấu kính.

+ Ánh sáng phản xạ lại từ thấu kính không được phản xạ trực diện với ánh sáng tới. Thông thường sẽ điều chỉnh để ánh sáng phản xạ lại ở vị trí xung quanh viền của shutter. (Hình 4.2.3)

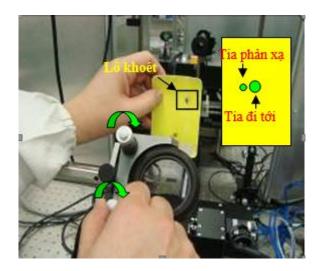


Hình 4.2.3

Hình 4.2.4

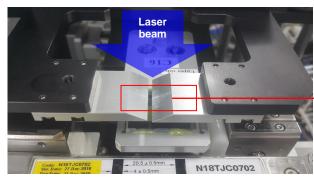
4.2.3 Ánh sáng phản xạ lại từ phase mask.

+ Ánh sáng phản xạ lại từ phase mask không được phản xạ trực diện với ánh sáng tới. Ánh sáng phản hồi bị lệch xa thì điều chỉnh trực X,Y sao cho tia đi tới và tia phản hồi nằm thẳng hàng (bên trái hoặc bên phải đều được) và lệch nhau khoảng từ 1mm đến 2mm

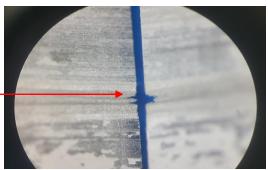


Hình 4.2.5

5. Hướng dẫn điều chỉnh vị trí slit length khi slit length bị mòn hoặc mẻ



Hình 5.1.1



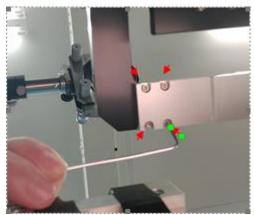
Hình 5.1.2

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 16/35

5.2. Cách chỉnh vị trí slit length và kiểm tra

Bước 1: Dùng lục giác nới lỏng các ốc giữ của slit length.



Hình 5.2.1

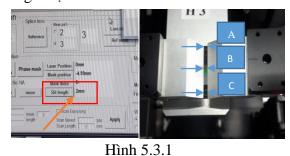
Bước 2 : Di chuyển slit length lên hoặc xuống để tránh vị trí bị mòn, mẻ (chú ý phải di chuyển cả hai bên của slit length theo cùng một hướng), sau đó siết chặt ốc lại.



Hình 5.2.2

Bước 3: Kiểm tra khoảng cách slit length

+ Chỉnh giá trị slit length trên chương trình bằng 2 mm. Kiểm tra khoảng cách thực tế của slit length tại 3 điểm A, B, C bằng cách bắn tia laser trên giấy rồi dùng thước để đo (Dung sai cho phép \pm 0.05mm). Sau đó, trả giá trị slit length về giá trị trước khi điều chỉnh







Hình 5.3.2

Bước 4. Kiểm tra giá trị FWHM tại công đoạn Exposing và Loss measurement

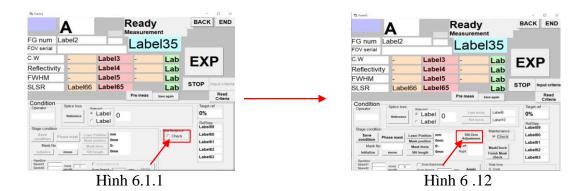
+ Test thử 3 pcs tại công đoạn Exposing và test Loss để đánh giá sự ổn định của giá trị FWHM trước khi chạy hàng Mass production.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

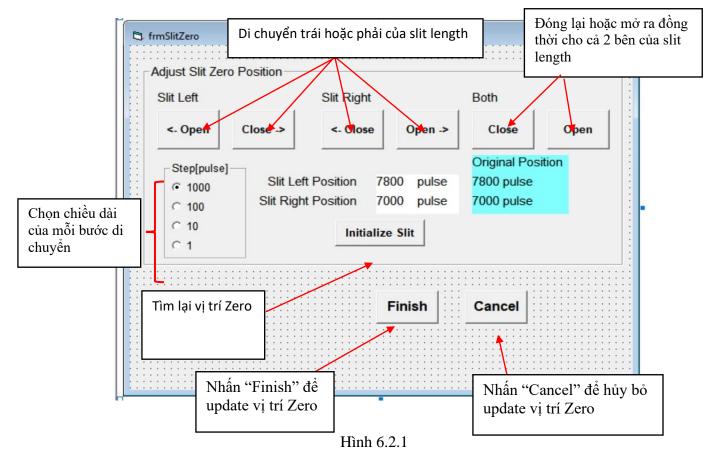
Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 17/35

- 6. Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh vị trí Zero-slit length của chương trình Exposing.
- 6.1 .Trường hợp sử dụng chức năng điều chỉnh vị trí Zero của slit length
- + Cài đặt chương trình Exposing cho line Exposing mới
- + Cần tìm lại vị trí Zero của slit length
- 6.2. Cách sử dụng chức năng điều chỉnh vị trí Zero slit length

Bước 1: Mở chương trình Exposing ver9 → nhấn nút "check" → chọn "Slit Zero Adjustment".



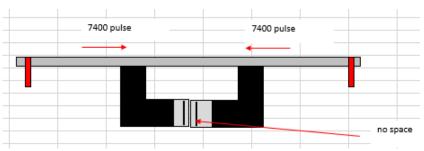
Bước 2 . Nhấn nút " Open slit " → Chương trình sẽ hiện lên bảng " Adjust Slit Zero Position "



Bước 3. Di chuyển bên trái và bên phải slit length cho đến khoảng cách slit length bằng Zero

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 18/35



Hình 6.3.1

Chú ý: Khi căn chỉnh cố gắng các phần dưới đây gần ở giữa

- + Vị trí slit length ở giữa
- + Vị fiber setting ở giữa
- + Vị trí bộ gia nhiệt ở giữa

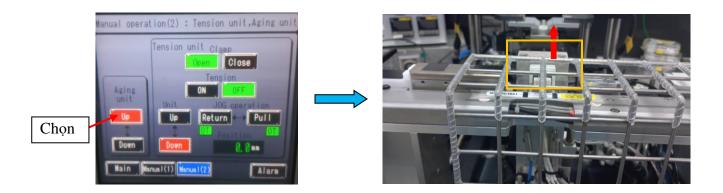
Dùng template để kiểm tra độ thẳng hàng giữa slit length, vị trí fiber và bộ gia nhiệt theo các bước sau:

+ Tại màn hình điều khiển → chọn "manual 1 " → Chọn "Front " → Trục của Exposing di chuyển về phía trước



Hình 6.3.2

+ Tại màn hình điều khiển → chọn "manual 2 " → Phần Aging unit chọn "Up" → Bộ gia nhiệt đi lên



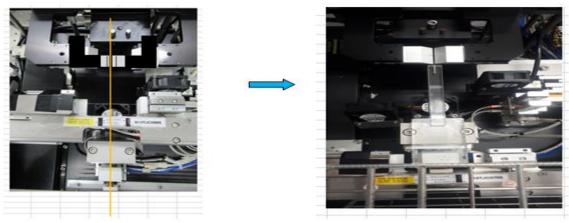
Hình 6.3. 3

- + Đặt Tempalte cố định trên bộ gia nhiệt. Sau đó kiểm tra độ thẳng hàng của giữa slit length, vị trí fiber và bộ gia nhiệt
- Trường hợp 1: Thẳng hàng → tiến hành bước 4

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 19/35

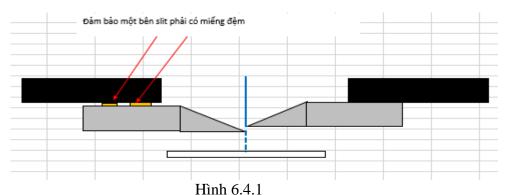
- Trường hợp 2 : Không thẳng hàng → Cài đặt lại bước 2



Hình 6.3.4

Bước 4 . Kiểm tra vị trí Zero của slit length

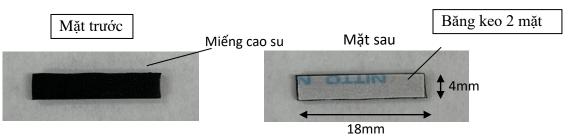
Kiểm tra vị trí Zero của slit length bằng gương → đảm bảo laser không được lọt qua khe Chú ý : Một bên slit phải có miếng đệm để slit có thể trượt lên nhau



Cuối cùng nhấn nút "Finish" để update vị trí Zero.

7. Hướng dẫn thay thế miếng cao su của má cặp tension

7.1 . Vật tư cần chuẩn bị : Rubber Akitsu Industry, model: CB260N-1-100-100



Hình 7.1 Miếng cao su thay thế

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 20/35

7.2. Phương pháp thay thế



Hình 7.2

Bước 1.Gỡ bỏ miếng cao su hiện tại trên má kẹp tension
Bước 2.Dùng giấy wipe – clean tẩm cồn vệ sinh sạch sẽ má kẹp tension .
Bước 3.Dán miếng cao su mới vào má kẹp tension .
Bước 4.Kiểm tra miếng cao su mới thay đẩm bảo không bị bong keo ,
bề mặt sau khi thay phẳng, không

7.3. Quy trình kiểm tra sau khi thay



Bước 1: đặt fiber vào máy exposing

biến dạng.



Bước 2: Tại màn hình điều khiển máy exposing, ghi nhận giá trị tension hiện hành. Sau đó cài đặt lên giá trị 80g



Bước 3: Nhấn nút chọn "Manual (2)"

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 21/35



Bước 4: Tại giao diện "Manual (2)" nhấn nút "Up" của Tension unit



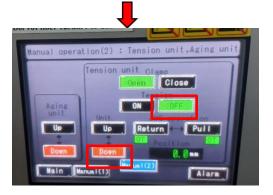


Bước 5 : Tại giao diện " Manual (2) nhấn nút "On" của Tension unit .

Chờ nút "On" ngừng nhấp nháy

Trường hợp 1: Nếu má cặp tension không giữ được fiber nút "Alarm" sẽ sáng và báo lỗi => Tiến hành thực hiện lại mục "7.2. Thay thế".

Trường hợp 2 : Nếu má cặp tension giữ được fiber => thực hiện bước 6



Bước 6: Nhấn nút " OFF" và sau đó nhấn nút "Down" của Tension unit Bước 7: Lấy fiber ra khỏi máy + Kiểm tra bề mặt fiber tại khu vực má cặp tension

Chú ý: + Thực hiện 3 mẫu cho mỗi loại fiber (SM,PM,PM 80um)
 + Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra phải trả giá trị
 "Load cell" về giá trị ban đầu

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 22/35

8. Hướng dẫn thay thế miếng cao su của má kẹp tự động

8.1. Vật tư cần chuẩn bị: Miếng cao su model RBSMA0.5-10

Mặt sau Mặt trước



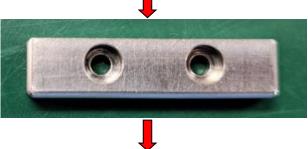


30.08 mm

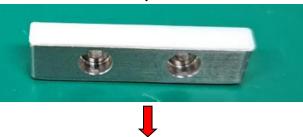
8.2: Phương pháp thay thể.



Bước 1: Tháo bên má kẹp có gắn miếng cao su ra khỏi bộ má kẹp tự động.



Bước 2: Dùng giấy wipe – clean tẩm cồn vệ sinh sạch sẽ má kẹp và lỗ ren.



Bước 3: Dán miếng cao su mới vào má kẹp vào kiểm tra miếng cao su mới thay đảm bảo không khi thay phẳng, không biến dạng.

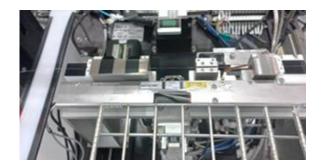


Bước 4: Dùng lục giác siết chặt má kẹp đã dán miếng cao su mới vào bộ má kẹp tự động.

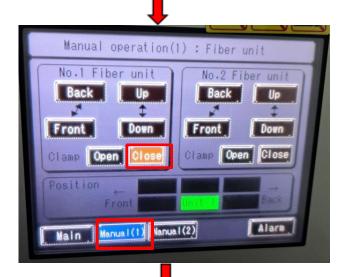
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 23/35

8.3: Quy trình kiểm tra sau khi thay.



Bước 1: đặt fiber vào máy exposing.



Bước 2: Tại màn hình điều khiển máy exposing chọn Manual 1 → bấm Close cho má kẹp tự động đóng lại

Trường hợp 1: nếu má kẹp không giữ được fiber thì thực hiên lại mục 7A2- Bước 4.

Trường hợp 2: nếu má kẹp tự động giữ được fiber thì đơi khoảng 10s rồi thực hiên tiếp Bước 3.



Bước 3: ở màn hình Manual 1 bấm Open cho má kẹp tự động mở ra.

Bước 4: Lấy fiber ra khỏi máy. + kiểm tra bề mặt fiber tại khu vực vị trí má kẹp tư đông

Chú ý: khi thay miếng cao su cho má kẹp tự động phải thực hiện kiểm tra 3 mấu fiber. + Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra bấm Main về màn hình chạy sản phẩm.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 24/35

- 9. Hướng dẫn cài đặt chương trình Exposing Version10
 - 9.1 Cài đặt Driver cho (I/O) cho Windown 10

[Chuẩn bị vật tư]

| S | ГТ. | Item | Model | pcs | Lưu ý |
|---|-----|-----------------------|---|-----|--|
| | 1 | Máy tính Windows10 | - | 1 | Có thể gắn card I/O |
| | 2 | Card I/O | PIO-16/16L(PCI)H DIO-1616L-LPE DIO PIO-32/32L(PCI)H DIO-3232L-PE | 1 | Chọn loại card phù hợp với chân cắm của máy tính được chọn để nâng cấp |

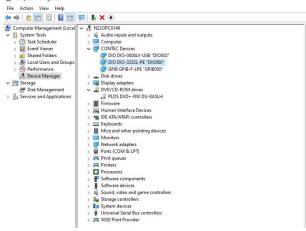
[Cài đặt Driver]

Bước 1: Chay file Setup.exe trong đường dẫn

S:\FOV-ODD\Contec Driver\LZF826DIOWDM_730F\INF\WDM\Dio_ForWin10

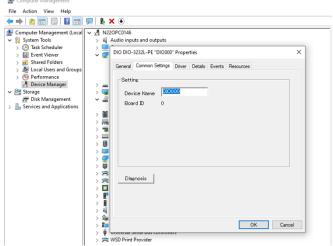
Bước 2: Tắt máy tính và gắn card I/O vào

Bước 3: Mở máy tính lên và vào Device Manager. Đảm bảo máy tính đã nhận card như ô đổ bên dưới



Bước 4: Mở Properties của card I/O trong device Manager

- Kiểm tra "Device Name" thành "DIO000"



- Nếu chưa thì tháo Card I/O ra cắm lại vào châm cắm khác rồi thực hiện lại bước 4

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 25/35

Bước 5: Chạy File "Setup.exe" trong đường dẫn bên dưới

S:\FOV-ODD\Contec Driver\LZF826DIOWDM_730F\APIPAC\DioWdm\Disk1

9.2 Cài đặt Driver GPIB cho Windown 10 [Chuẩn bị vật tư]

| Stt | Vật tư | Model | Pcs | Lưu ý |
|-----|------------|------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1 | Máy tính | - | 1 | Có thể gắn được card GPIB |
| | Windows10 | | | |
| | | • GB-IB(PCI)FL/GP-IB(LPCI)FL | | Chọn loại card phù hợp với chân |
| 2 | GPIB board | • GP-IB(PCI) | 1 | cắm của máy tính được chọn để |
| | | • GPIB-GPIB-F-LPE | | nâng cấp |

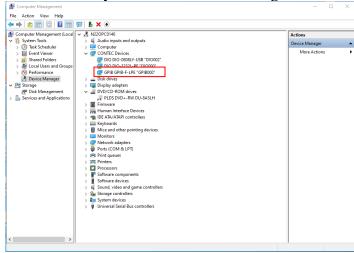
[Cài đặt Driver]

Bước 1: Chạy file "Setup.exe" trong đường dẫn

S:\FOV-ODD\Contec Driver\LZF826GPIB 630F\INF\WDM\Gpib forWin10

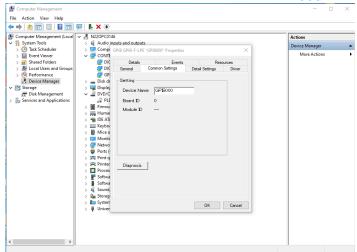
Bước 2: Tắt máy tính và gắn card GPIB vào

Bước 3:Mở máy lên và vào Device Manager . Kiểm tra xem card GPIB đã được nhận chưa



Bước 4: Mở properties của card GPIB trong Device Manager

Kiểm tra "Device Name" có thành "GPIB000"



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 26/35

Nếu chưa thì tắt máy cắm lại vào chân cắm khác rồi thực hiện lại bước 4
 Bước 5: Chạy file "Setup.exe" trong đường dẫn
 S:\FOV-ODD\Contec Driver\LZF826GPIB 630F\APIPAC\GPIB\Disk1

9.3 Cài đặt Contec Driver (giao tiếp kết nối) cho Windown 10 [Chuẩn bị vật tư]

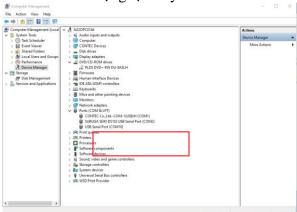
| STT. | Vật tư | Model | pcs | Lưu ý |
|------|------------------------|-----------------------|-----|-------|
| 1 | Máy tính Windows10 | - | 1 | - |
| 2 | Cổng USB cho RS232C | COM-1(USB)H (*RS232C) | 2 | - |

[Cài đặt Driver]

Bước 1: Chạy file "Setup.exe" trong đường dẫn

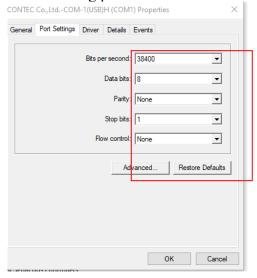
S:\FOV-ODD\Contec Driver\LZC147_WIN1USB_190\Usb\Com1Usb_forWin10

Bước 2: Khởi động lại máy tính và mở Device Manager



Đảm bảo các cổng trong phần đánh dấu đều đã được nhận

Bước 3: Mở properties của CONTEC Co.Ltd – COM-1(USB)H trong Device Manager Cài như trong phần đánh dấu



HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 27/35

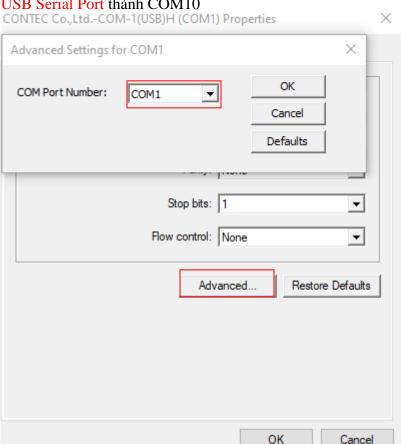
Bước 4: Bấm vào phím Advanced

Cài đặt:

CONTEC Co.Ltd-COM-1(USB)H thành COM1

SURUGASEIKI DS102 USB Serial port thành COM2

USB Serial Port thành COM10



10. Trường hợp đặc biệt Đối với máy tính sử dụng khai báo SWtype "IO-3"

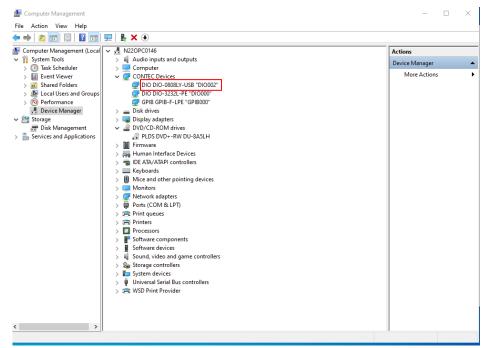
```
File Edit Format View Help
File Edit Format View Help

IP_address,Line,Ref_port,Meas_port1,Port1_loss,Meas_port2,Port2_loss,Ref_power,OSAtype,,,
192.168.25.103,A,1,2,0.25,3,0.25,14,AQ6370,IO-1,,
192.168.25.104,B,4,1,-0.01,2,-0.25,14.6,AQ6370,IO-1,,
192.168.25.105,C,4,1,-0.5,2,-0.4,16.8,AQ6370,IO-2,AFIDIO,
192.168.25.106,D,3,1,0.2,4,0.02,15.31,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.109,E,1,2,-1.2,4,-1.19,15.0,AQ6370,IO-2,CDIO,
192.168.25.110,F,1,2,-0.19,3,-0.18,14.75,AQ6370,IO-2,,
 192.168.25.16,G,4,1,-0.38,2,-0.4,15.1,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.112,H,4,1,0.15,2,-0.25,14.8,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.116,K,3,1,-0.1,2,-0.3,15.2,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.117,J,3,2,-0.9,4,-1.03.0,15.1,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.24,L,3,1,-0.65,2,-0.45,15.2,AQ6370,IO-2,,
```

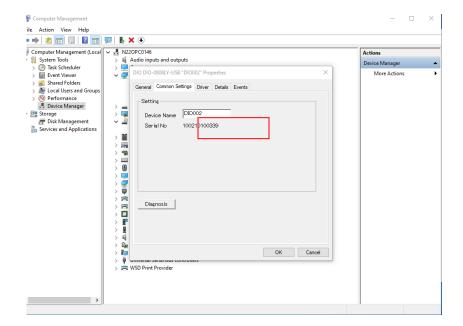
Bước 1: Mở Device Manager Chọn USB type I/O

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 28/35



Bước 2: Mở properties của USB type I/O Chỉnh tên thành "DIO002"



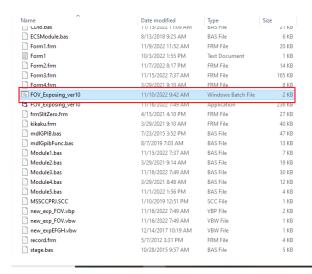
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 29/35

9.4 Cài đặt chương trình

Bước 1: Vào đường dẫn S:\Prog\EXPO copy thư mục Exposing_ver10 -> Paste file vào C:\Cavity

Bước 2: Sau đó mở file Exposing_ver10 -> Copy file FOV_Exposing_ver10.bat



Bước 3: Paste ra màn hình chính



Bước 4: Khai báo file cho các line exposing Đối với máy tính chạy Windown 10:

Thêm khai báo "CDIO" ở miền cuối cùng của line đang được cài đặt

```
File Edit Format View Help

[IP_address,Line,Ref_port,Meas_port1,Port1_loss,Meas_port2,Port2_loss,Ref_power,OSAtype,,,
192.168.25.103,A,1,2,0.25,3,0.25,14,AQ6370,IO-1,,
192.168.25.104,B,4,1,-0.01,2,-0.25,14.6,AQ6370,IO-1,,
192.168.25.105,C,4,1,-0.5,2,-0.4,16.8,AQ6370,IO-2,APIDIO,
192.168.25.106,D,3,1,0.2,4,0.02,15.31,AQ6370,IO-3,,
192.168.25.109,E,1,2,-1.2,4,-1.19,15.0,AQ6370,IO-2,CDIO,
192.168.25.110,F,1,2,-0.19,3,-0.18,14.75,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.110,F,1,2,-0.2,4,15.1,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.112,H,4,1,0.15,2,-0.25,14.8,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.116,K,3,1,-0.1,2,-0.3,15.2,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.117,J,3,2,-0.9,4,-1.03.0,15.1,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.117,J,3,2,-0.9,4,-1.03.0,15.1,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.24,L,3,1,-0.65,2,-0.45,15.2,AQ6370,IO-2,,
```

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

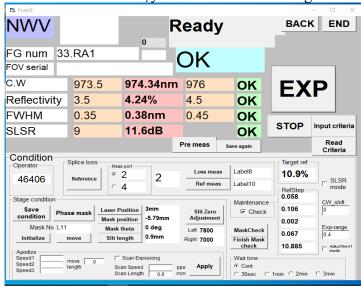
Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 30/35

Đối với máy tính chạy Windown 7:

Thêm khai báo "APIDIO" ở miền cuối cùng của line

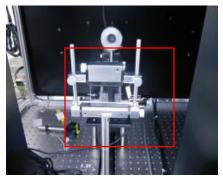
```
new_Machine - Notepad
      File Edit Format View Help
  IP_address,Line,Ref_port,Meas_port1,Port1_loss,Meas_port2,Port2_loss,Ref_power,OSAtype,,,,
| P_address, Line, Ret_port, Meas_port1, Port1_loss, Meas_port2, 192.168.25.103, A, 1, 2, 0.25, 3, 0.25, 14, AQ6370, IO-1, 192.168.25.104, B, A, 1, -0.01, 2, -0.25, 14.6, AQ6370, IO-1, 192.168.25.105, C, A, 1, -0.5, 2, -0.4, 16.8, AQ6370, IO-2, APIDIO, 192.168.25.109, E, 1, 2, -1.2, 4, -0.19, 15.0, AQ6370, IO-2, CDIO, 192.168.25.109, E, 1, 2, -1.2, 4, -1.19, 15.0, AQ6370, IO-2, CDIO, 192.168.25.100, F, 1, 2, -0.19, 3, -0.18, 14.75, AQ6370, IO-2, ODIO, 192.168.25.100, E, 1, 2, -0.19, 3, -0.18, 14.75, AQ6370, IO-2, ODIO, 192.168.25.100, E, 1, 2, -0.19, 3, -0.18, 14.75, AQ6370, IO-2, ODIO, 192.168.25.100, E, 1, 2, -0.19, 3, -0.18, 14.75, AQ6370, IO-2, ODIO, ID-2, ID-
   192.168.25.16, G, 4, 1, -0.38, 2, -0.4, 15.1, AQ6370, IO-2,,
  192.168.25.112,H,4,1,0.15,2,-0.25,14.8,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.116,K,3,1,-0.1,2,-0.3,15.2,AQ6370,IO-2,,
192.168.25.117,J,3,2,-0.9,4,-1.03.0,15.1,AQ6370,IO-2,,
   192.168.25.24,L,3,1,-0.65,2,-0.45,15.2,AQ6370,IO-2,,
```

Bước 5: Tiến hành chạy thử và kiểm tra chương trình



- + Khởi động chương trình và đăng nhập vào các nhóm hàng khác nhau
- + Quan sát và kiểm tra quá trình khởi động của hệ thống
- + Kiểm tra các phím chức năng của chương trình
- + Tiến hành quá trình exposing và kiểm tra với các loại hàng hoạt động đặt biệt (aging, apodized)
- + Tao điều kiên lỗi tuôt fiber để kiểm tra báo đông
- + Kiểm tra các file dữ liệu đã được lưu
- 10. Hướng dẫn điều chỉnh thấu kính hội tụ (gương giữa) 13



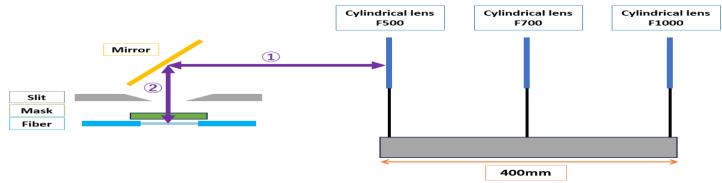


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 31/35

Hiện tại Cavity có 3 loại thấu kính: F500, F700,

F1000



Cách điều chỉnh 3 loại thấu kính để có thể đạt tốt nhất năng lượng:

- + F500 : tổng chiều dài ①+② ≤ 500mm
- + F700: tổng chiều dài ①+② \leq 700mm
- + F1000: tổng chiều dài ①+② ≤ 1000mm
- 11. Hướng dẫn phương pháp tìm điều kiện exposing

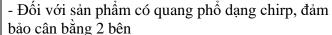


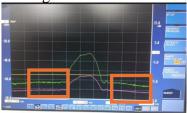
Bảng 4. Phương pháp tìm điều kiện exposing

| Sản phẩm có sử dụng apodization mode Bước 1: Khởi động chương trình và đăng nhập loại hàng cần tìm điều kiện Bước 2: Ghi nhận giá trị Apodize để input tại bước 5. Điều chỉnh thông số apodization mode bằng (-) như hình. | Sản phẩm không có sử dụng apodization mode Bước 1: Khởi động chương trình và đăng nhập loại hàng cần tìm điều kiện Bước 2: Chỉnh vị trí fiber nằm giữa vùng ánh sáng Fiber Line A Anh sáng |
|--|--|
| Bước 3 : Chỉnh vị trí fiber nằm giữa vùng ánh sáng Fiber Line A Anh sáng | Bước 3: Tìm điều kiện exposing sao cho: - Đối với sản phẩm có quang phổ dạng Uniform, đỉnh bước sóng thứ cấp bên trái và phải phải bằng nhau |
| Bước 4 Tìm điều kiện exposing sao cho: - Đối với sản phẩm có quang phổ dạng Uniform, đỉnh bước sóng thứ cấp bên trái và phải phải bằng nhau | The state of the s |

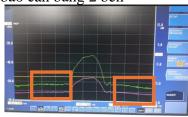
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 32/35





- Đối với sản phẩm có quang phổ dạng chirp, đảm bảo cân bằng 2 bên



Bước 5 : Cài đặt lại giá trị thông số của appodize mode như hình bên dưới

| Speed1 | 380 |
|--------|-----|
| Speed2 | 30 |
| Speed3 | 300 |

Bước 4 : Chỉnh thông số slit length, mass position REF value, chu kì sao cho các giá trị REF, FWHM, CW ,SLSR thỏa mãn tiêu chuẩn

Chú ý: giá trị này có thể thay đổi tùy theo từng loại sản phẩm

| Bước 6 : Chỉnh thông số slit length, mass position |
|--|
| REF value, chu kì sao cho các giá trị REF, |
| FWHM, CW, SLSR thỏa mãn tiêu chuẩn |

Bước 5 : Chạy 5 pcs ID test để kiểm tra giá trị trước khi chạy hàng đại trà

Bước 7 : Chạy 5 pcs ID test để kiểm tra giá trị trước khi chay hàng đai trà

V. Câu hỏi kiểm tra kiến thức

1) Mục đích của công đoạn Exposing là gì?

- a. Dùng ánh sáng laser để phá hủy cấu trúc của fiber để tạo ra bước sóng theo yêu cầu.
- b. Dùng ánh sáng laser để làm sạch vỏ UV còn bám lại trên fiber trần sau khi stripping.
- c. Dùng ánh sáng laser để giải phóng khí hydro ra khỏi đoạn fiber trần sau khi stripping.
- d. a & c đều đúng

2) Hãy cho biết giá trị loss của mối hàn tại công đoạn exposing nằm trong khoảng bao nhiều là đạt?

- a. Từ 0.00 đến 0.05dB
- b. Từ 0.05 đến 0.10dB
- c. Từ -0.1 đến 0.3dB
- d. Không quy đinh

3) Giá trị nào sau đây sẽ bị ảnh hưởng chính khi chỉnh phần trăm target?

- a. Center Wavelength
- b. Reflectivity
- c. Full Width Half Max
- d. SLSR

4) Trên chương trình exposing, muốn điều chỉnh giá trị FWHM thì phải chỉnh thông số nào sau đây?

- a. Mask position
- b. Mask theta
- c. Slit length
- d. Laser position

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 33/35

- 5) Trên chương trình exposing, muốn điều chỉnh giá trị Center Wavelength thì phải chỉnh thông số nào sau đây?
 - a. Laser position
 - b. Mask position
 - c. Move length
 - d. Scan length
- 6) Đối với một số dòng sản phẩm, trong quá trình exposing, slit length di chuyển liên tục nhằm mục đích gì?
 - a. Ôn định giá trị Reflectivity
 - b. Giảm chu kì exposing
 - c. Đè 2 cánh của spectrum để tăng giá trị SLSR.
 - d. Tăng giá trị CW
- 7) Chế độ hoạt động nào của máy excimer laser dùng để chạy hàng?
 - a. EGY-PGR-40Hz
 - b. EGY-NGR-40Hz
 - c. HV-PGR-40Hz
 - d. HV-NGR-40Hz
- 8) Để điều chỉnh giá trị SLSR thì phải điều chỉnh gì?
 - a. Điều chỉnh giá trị mask theta
 - b. Điều chỉnh chu kỳ
 - c. Điều chỉnh ánh sáng phản xạ lại từ phase mask
 - d. Điều chỉnh vi trí laser beam
- 9) Bước sóng hoạt động của máy Excimer laser là bao nhiều?
 - a. 351nm
 - b. 308nm
 - c. 248nm
 - d. 193nm
- 10) Phím chức năng nào trên bộ điều khiển dùng để kiểm tra phần trăm bộ lọc của máy Excimer laser?
 - a. F1
 - b. F2
 - c. F4
 - d. F5
- 11) Để kiểm tra số SHOT đã sử dụng của máy Excimer laser cần phải bấm nút nào trên bộ điều khiển?
 - a. COUNT -> SEL
 - b. MENU -> SEL
 - c. GAS -> NEWFILL
 - d. EGY CAL
- 12) Cách điều chỉnh ánh sáng phản xạ như thế nào?
 - a. Tia đi tới và tia phản hồi nằm lệch nhau từ 1mm đến 2mm
 - b. Tia đi tới và tia phản hồi nằm thẳng hàng và lệch nhau từ 1mm đến 2mm
 - c. Tia đi tới và tia phản hồi nằm lệch nhau từ 3mm đến 4mm
 - d. Tia đi tới và tia phản hồi nằm lệch nhau từ 5mm đến 6mm
- 13) Đối với loại hàng có quang phổ dạng Chirped thì khi tăng slit length thì FWHM thay đổi như thế nào?
 - a. FWHM giảm
 - b. FWHM tăng
 - c. Không ảnh hưởng tới giá tri FWHM

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 34/35

14) Đối với loại hàng có quang phổ dạng Uniform thì khi tăng slit length thì FWHM thay đổi như thế nào?

- a. FWHM giảm
- b. FWHM tăng
- c. Không ảnh hưởng tới giá trị FWHM

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

| Ngày | Người thực hiện | Phiên bản | Nội dung cũ | Nội dung mới | Lý do thay đổi | Người yêu cầu |
|-------------|--------------------|--------------|--|--|---|---------------|
| 25/Sep/24 | VietTA | 13 | - Phạm vi áp dụng: Có Leader Technician/Technician/ - N/A | - Phạm vi áp dụng: Bỏ Leader Technician/ Technician -Thêm mục 10 Hướng dẫn điều chinh thấu kính hội tụ (gương giữa) -Thêm mục 11 Hướng dẫn phương pháp tìm điều kiện exposing | -Áp dụng sơ đồ tổ chức mới -Bổ sung kiến thức mới theo closing meeting with ODD ngày 2/8/2024 | ChienPH |
| 22/Nov/2023 | NguyenVT | 12 | Mục 3: Các thông số Exposing. Bảng 1: Xử lí sự cố chung - Giá trị Reflectivity không ổn định - Giá trị FWHM dao động | Mục 3: Các thông số Exposing. Bảng 1: Xử lí sự cố chung - Giá trị Reflectivity không ổn định: Thêm bước kiểm tra giá trị Reflectivity step - Giá trị FWHM dao động: Thêm bước kiểm tra phase mask | Cập nhật thêm theo hướng dẫn của ODD | TrungDN |
| | | | V. Nội dung - N/A | Thêm mục 8 .Hướng dẫn thay thế miếng cao su của má cặp tự động | | |
| | | | Mục 9. Quy định chung -N/A - Bảng tham khảo chọn phase mask theo từng loại hàng | Đổi thành mục IV. Quy định chung Khi tiến hành bảo trì máy cần chú ý tắt máy, khóa các van khí, ngắt nguồn điện trước khi thực hiện. Chuyển lên mục 3. Các thông số Exposing | | |
| 28/Aug/23 | VietTA | 11 | 3. Các thông số Exposing Mask position: điều chỉnh giá trị CW Dối với quang phổ dạng Uniform: Tăng mask position -> CW giảm Giảm mask position -> CW tăng Dối với quang phổ dạng Chirp: Tăng mask position -> CW | 3. Các thông số Exposing •Mask position: điều chỉnh giá trị CW - Đối với quang phổ dạng Chirp: + Tăng mask position -> CW giảm + Giảm mask position -> CW tăng -Đối với quang phổ dạng Uniform: | Cập nhật lại thông tin cho đúng | TrungDN |

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA DỮ LIỆU QUANG HỌC VÀ CHỈNH ĐIỀU KIỆN EXPOSING

Số: 000-4-WI-0182 Phiên bản: 13 Trang: 35/35

| | | | tăng + Giảm mask position -> CW giảm | + Tăng mask position - >CW tăng + Giảm mask position -> CW giảm | | |
|-----------|--------|----|---|--|-------------------------------|---------|
| | | | I .Định nghĩ thuật ngữ N/A | I.Định nghĩ thuật ngữ Spectrum Uniform: Spectrum Chirp: Apodization: | Cập nhật thêm | TrungDN |
| | | | 3. Các thông số Exposing N/A | 3. Các thông số Exposing + Thêm mục phase mask + Spectrum type | Bổ sung kiến thức mới | TrungDN |
| 26/Jul/23 | VietTA | 10 | 3. Các thông số Exposing Mask position: điều chỉnh giá trị CW + Đối với phase mask loại C + Đối với các loại phase mask còn lại | 3. Các thông số Exposing Mask position: điều chỉnh giá trị CW + Đối với quang phổ dạng Uniform + Đối với quang phổ dạng Chirp | Cập nhật thông tin cho rõ hơn | TrungDN |
| | | | 8 . Qui định chung N/A | 8. Qui định chung - Khi tìm điều kiện của sản phẩm mới hoặc line mới phải sử dụng template 4-Pr-007-4-Fo-0006-4-TEM-0001 để kiểm tra các thông số trước khi chạy sản phẩm hàng loạt. | Cập nhật thêm | TrungDN |
| 22/Nov/22 | HuyDM | 09 | N/A | Thêm mục 9: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cho chương trình Exposing ver_10 | Cập nhật thêm | ChienPH |